|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TEM |
| RICHIESTA DI ANALISI AL SERVIZIO DI MICROSCOPIA ELETTRONICA IN TRASMISSIONE (TEM) |
| compilare tutti i campi in modo chiaramente leggibile e inviare a **temf20@unimi.it** |
|  |
| **IDENTIFICAZIONE DELL’UTENTE** |
|  |
| DIPARTIMENTO / ENTE / SOCIETA’ : ……………………………………………… | DATA : ………………………….. |
| INDIRIZZO : ……………………………………………… |
| RICHIEDENTE : ………………………… | Nº TEL. : ………………………… | e-mail : ………………………………… |
| **Progetto U-GOV (1) : ………………………………….****RESPONSABILE : …………………………………….** | **FIRMA : ………………………………………………..****(anche per presa visione delle tariffe applicate)** |

|  |
| --- |
| **IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE** |
| SIGLE : **…………………………………………………………………….** |
| MATERIALI (es. minerali, metalli e leghe, composti di sintesi, etc.) : …………………………….............................. |
| TIPOLOGIA DI CAMPIONE (es. polvere policristallina, retino/griglia TEM, materiale assottigliato) : …………….…...…… |
| TIPO DI PREPARAZIONE (es. ultrasuoni, assottigliamento ionico, dispersione) : …………………………………………………….ELEMENTI CHIMICI DA IDENIFICARE/QUANTIFICARE (EDS): ………………………………………………………..……. |
| RICHIESTA RETINI/GRIGLIE TEM (oro, rame, carbon holey, film di carbonio amorfo, SiN etc) e n. : ……………………………. |
| SENSIBILITA’ AL FASCIO ELETTRONICO : ………………………………………………………………………………..………..…… |
| ESAME DIFFRATTOMETRICO : ☐ SI ☐ NO N. DIFFRAZIONI : ………………………… |
| IMMAGINI DI DIFFRAZIONE ORIENTATE : [ ]  SI [ ]  NO  |
| N. ANALISI PUNTUALI : ………………….. |
| N. DIFFRAZIONI ORIENTATE: ………………..N. IMMAGINI RISOUZIONE STANDARD……………N. IMMAGINI ALTA RISOLUZIONE……………. |
| TITOLO DEL PROGETTO…………… |
| RESPONSABILE SCIENTIFICO………… |
| **I CAMPIONI DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI AL LABORATORIO IN ANTICIPO IN CASO DI PARTICOLARI PREPARAZIONI, OVE NECESSARIO** |
| ALLEGARE IMMAGINE DEL CAMPIONE o ALLEGARE IMMAGINI DI RIFERIMENTO SE ESISTENTI |
| NOTE (del richiedente) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| **(1)** da indicare solo per strutture dell’Università degli Studi di Milano  **mod. marzo 2024** |

|  |
| --- |
| Please, **acknowledge the Unitech COSPECT Transmission Electron Microscope facility** in your publications and grant applications where the facility instrumentation used and expertise, provided by our staff, contributed to the final work product: e.g. “TEM analyses were performed at the TEM facility of the Unitech COSPECT at the University of Milan (Italy)”.Please, send us a pdf of your newly accepted papers if they contain data generated by the Unitech COSPECT TEM facility. Also, please let us know if your grants that contain the Unitech COSPECT TEM facility-generated data are awarded. |